

国外开发出可使用多种中子源的半导体软错误率评估方法

稿件来源: 政策研究与驻外指导处 2023/6/28

由日本京都大学科研人员负责的产学协同软错误研究团队, 开发了一种可使用不同中子源获取半导体软错误率的方法。

软错误率一般通过在地面上再现宇宙射线环境的特殊中子源进行实验评估。而该方法则是通过将任意中子源的1个测量结果和数值模拟进行组合求得软错误率。科研人员使用来自3个设施的7种类型中子源的测量值和高能粒子与重离子运动分析代码程序PHITS (Particle and Heavy Ion Transport code System) 评估软错误率, 验证了该方法的有效性。采用这种方法, 科研人员可以使用大量的通用中子源来评估软错误率, 满足日益增长的软错误率评估需求。相关研究成果发表于国际学术期刊《IEEE Transactions on Nuclear Science》。

本文摘自国外相关研究报道, 文章内容不代表本网站观点和立场, 仅供参考。

相关链接

新西兰加入欧盟“地平线欧洲”研发计划 (2023/8/22)

瑞典试验出量子连续变量多组分纠缠 (2023/8/22)

韩国研究阐释“液体摩擦”电荷序列 (2023/8/21)

西班牙Odón de Buen号科考船下水 (2023/8/21)

[江苏]江苏省科技厅组织高科技企业赴韩国、日本加强技术交流合作 (2023/8/1)

主办单位: 中华人民共和国科学技术部 地址: 北京市复兴路乙15号 邮编: 100862
版权所有 未经同意 不得转载 ICP备案序号: 京ICP备05017536号 网站标识码: bm06000003



中国科学技术部



中华人民共和国外交部



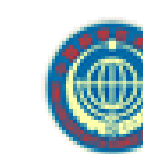
中国科学院



中国工程院



国家自然科学基金委员会



中国科学技术协会